



## □ 第336回例会開催案内

終了しました。

第336回例会を下記の通り企画致しましたので、万障繰り合わせの上、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。

主催 (社) 日本分析化学会 高分子分析研究懇談会

日時 2007年2月7日(水) 13時20分～16時50分

場所 ゆうぽうと6階「末広」(電話03-3490-5111, JR山手線五反田駅下車徒歩5分)

会場案内図 <http://www.kt-net.jp/upt.html>

講演1 (13:20～14:20)

「イオン付着質量分析法によるリアルタイム測定の高分子材料への応用」

(キヤノンアネルバテクニクス(株) 技術開発本部) 丸山 はる美

分子を壊さず検出可能なイオン付着質量分析法(IAMS)は一成分に1ピークを得られるため比較的狭雑物の影響を受けずに直接測定が可能です。RoHS規制物質である臭素系難燃剤など材料中添加物の迅速測定法を紹介すると共に、材料の熱分解ガスのリアルタイム測定例を紹介し、材料のキャラクタリゼーションや熱反応の解明など、IAMSの可能性を一緒に考えたいと思います。

ワークショップ1 (14:30～15:00)

「偏光ATRを活用した高分子材料の配向性評価」

(旭化成(株) 基盤技術研究所) 池田 俊之

近年、電子材料用途としてポリイミドをはじめとする薄膜の需要が一層高まってきた。そのため、これらの薄膜の物性を左右する膜中分子主鎖の三次元的な配向を把握することが重要である。赤外分光法の場合、特定の官能基について選択的に配向状態を知ることができるだけでなく、結晶、非晶の別なく、分子主鎖の三次元的な配向解析が可能である。赤外分光法による一般的なポリイミドの配向解析の事例を紹介するとともに、X線を用いた配向解析にも触れ、これらの相補的な解析の有用性を紹介する。

ワークショップ2 (15:10～15:40)

「On-line SEC/ESIMSを用いた合成高分子の構造解析」

(住友化学(株) 情報電子化学品研究所 分析物性グループ) 土田 好進

一般的に分子量分布の広い合成高分子を直接質量分析法で解析する事は非常に困難である。しかし、逆に分布の広さを利用し低分子量成分に注目して質量分析法で解

析すれば合成高分子の繰り返し構造等の重要な情報を得る事が可能であると考えられる。

我々はSECを高分子量成分除去の前処理手段と位置付けOn-lineでESIMS法と結合して様々な合成高分子の構造解析に応用している。低分子量成分をターゲットにした事とESIMS法を選択した事により安価な四重極型質量分析計でも構造解析の実用に足る結果が得られている。講演では、基礎検討としてPMMAを用いて、分子量の推定精度及びカチオン化剤の検討結果を、応用例としてMAMA/GBMAコポリマーの解析事例を紹介する。

講演 2 (15:50~16:50)

「イオン性両親媒性高分子の特性と自己組織化」

(京都大学大学院工学研究科 高分子化学専攻) 松岡 秀樹

イオン性高分子鎖と疎水鎖からなる両親媒性ブロックコポリマーは、気水界面に吸着することなく、水中でミセルを形成するという界面化学の常識では考えられない挙動を示す。これは、高分子性とイオン性、そして両親媒性が微妙にバランスした結果と考えられる。またそのミセルは高塩濃度耐性を示すことが特徴であるが、その構造と転移をX線および中性子小角散乱で調査した結果を述べる。さらに、気水界面に形成する単分子膜、特に親水鎖部分が形成する高分子電解質ブラシのナノ構造とその転移をX線および中性子反射率法にて精査した結果についても講述する。

申込方法 参加希望者は、氏名、勤務先及び連絡先を、Eメールにより下記までお知らせ下さい。また、例会における講演テーマ、講師などに関してご希望・ご意見などがありましたら、併せてご連絡をお願いします。

申込先 〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-26-2 五反田サンハイツ304号  
社団法人 日本分析化学会 高分子分析研究懇談会

[電話：03-3490-3351, FAX：03-3490-3572, E-mail: hm\_tanaka@\*jsac.or.jp (送付時には\*マークを削除下さい) ]